Se	arcn Not	es

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/615,519	LEE ET AL.		
Examiner	Art Unit		
Mike Fatahiyar	2674		

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
345	60-72, 211-213	9/29/2005	MF31		
315	169.1, 169.4	9/29/05	MF		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
•					
	•				

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH		')
:	DATE	EXMR
EAST search and Inventor's name search	9/29/05	MF
Interference Search History Printout	9/30/05	MF
<u> </u>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· :		
· : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		;
· · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u>.</u>